HYDROGEN-PERMEABLE MEMBRANE AND ITS PREPARATION

Publication number: JP11286785 Publication date: 1999-10-19

Inventor: SEKI TSUTOMU
Applicant: TOKYO GAS CO LTD

Classification:

-International: B01D71/02; C01B3/56; C23C14/14; C23C18/44; C23C18/52; C23C14/14; B01D71/00; C01B3/00; C23C14/14; C23C18/16; C23C18/31; C23C14/14;

(IPC1-7): C23C18/44; B01D71/02; C01B3/56; C23C14/14; C23C18/52

- European:

Application number: JP19980103695 19980331 Priority number(s): JP19980103695 19980331

Report a data error here

Abstract of JP11286785

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a hydrogen-permeable membrane by forming a dense Pd alloy membrane free from pilhotes on a porous substrate. SoLUTION: This hydrogen-permeable membrane has a Pd alloy membrane on the surface of a porous substrate. The Pd alloy membrane is formed by alternately aiminating metal Pd and a metal alloying with Pd on the surface of the porous substrate in multiple layers by electroless plating or ion plating so that the uppermest layer is the Pd layer and then heal-treating the laminate.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-286785 (43)公開日 平成11年(1999)10月19日

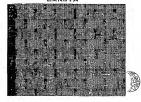
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
C23C 18/	44	C 2 3 C 18/44
B01D 71/	02 500	B 0 1 D 71/02 5 0 0
C01B 3/	56	C 0 1 B 3/56 Z
C23C 14/	14	C 2 3 C 14/14 G
18/	52	18/52 B
		審査請求 未請求 請求項の数16 FD (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平10-103695	(71)出願人 000220262 東京瓦斯株式会社
(22) 出願日	平成10年(1998) 3 月31日	東京都港区商岸 1 丁目 5 番20号 関 務 神奈川県横浜市韓見区岸谷 1 一 3 一 25 一 505
		(74)代理人 弁理士 加茂 裕邦

(54) 【発明の名称】 水素透過膜及びその作製方法

(57)【要約】

【課題】多孔質支持体に対してピンホールのない緻密な Pd合金膜を形成してなる水素透過膜を得る。

【解決手段】多孔質支持体の表面にPd合金膜を有する 水素透過膜であって、該Pd合金膜が、該多孔質支持体 の表面に対して無電解メッキ法又はイオンプレーティン グ法によりPd金属と該Pdと合金化する金属とをその 最上層がPd層となるように交互に多層化層とした後、 熱処理して形成されたPd合金膜であることを特徴とす る水素透過膜及びその作製方法。



【特許請求の範囲】

【請求項】 多孔質支持体の表面にPd含金酸を有する 水素透過酸であって、該Pd含金酸が、該多孔質支持体 の表面に対して無電解メッキ法によりpd金属と該Pd と合金化する金属とをその後上層がPd根となるように 交互に多層化層とした後、熱処理して形成されたPd合 金酸であることを特徴とする水素透過膜、

【請求項②】多孔領支持体の表面にP 0 合金服を有する 水素澄過騰であって、該P 0 合金膜が、該多孔質支持体 の表面に対してイオンプレーティング法によりP 0 金属 と該P 0 と含金化する金属とを交互に多層化層とした 後、熱処理して形成されたP 0 合金膜であることを特徴 とする水素溶過騰。

【請求項3】多孔質支持体の表面にP e 合金販を有する 水紫沿途順であって、該P e 合金販が、該多孔質支持体 の表面に対してイオンプレーディング法によりP e d 金属 と該P e d と合金化する金属とをその最上層がP e d 層と るように交互に多層化層とした後、熱処理して形成され アトロ会金館でたることを確保とする水紫帯が勝

【請求項4】多孔質支持体の表面にPd合金膜を有する 水素添給機であって、能Pd合金膜が、最多孔質支持体 吸表面に対して無電解メッキを記が、まか見から が表面に もり形成されたPd会屋の第1層上に、Pdと合 金化する金属とPd金属とをウエットプロセス又はドラ イプロセスにより交互に多層に関とした後、熱処理して 形成されたPd合金膜であることを特徴とする水素透過 順。

【請求項5】上記イオンプレーティング法が、アークイ オンプレーティング法である請求項2、3又は4記載の 水素诱過離

【請求項6】上記多孔質支持体がステンレス鋼製又はセラミックス製の多孔質支持体である請求項1、2、3又は4記載の水素透過騰。

【請求項7】上記Pdと合金化する金属が、Ag、Au、Pt、Rh、Ru、Ir、Sc、Y、Ce、SmX はGdである請求項1、2、3又は4記載の水素透過 脱、

【請求項8】上記Pd金属と該Pdと合金化する金属の 多層化層が、Pd金属と該Pdと合金化する金属とを交 互に多層化した各層の厚みが2μm以下の多層化層であ ることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の水素 添過限。

【請求明9】多孔順支持体の表面にPd合金銀を有する 水素透過機の作製方法において、該多孔質支持体の表面 に対して無電解メッキ法によりPd金属と該Pdと合金 化する金属とをその最上層がPd層となるように交互に 多層化した後、熱処理することを特徴とする水素添過順 の作電方法。

【請求項10】多孔質支持体の表面にPd合金膜を有する水素透過膜の作製方法において、該多孔質支持体の表

面に対してイオンプレーティング法によりPd金属と該Pdと合金化する金属とを交互に多層化した後、熱処理することを特徴とする水素透過隙の作製方法。

【請求項11】多孔質支持体の表面にPd合金膜を有す る水潔透過膜の仲製方法において、認多孔質支持係の表 面に対してイカンアレーティング法によりPdを設 Pdと合金化する金属とをその最上層がPd層となるよ うに交互に多層化した後、発処理することを特徴とする 水塞路過機の停車方法。

【請求項12】多孔質支持体の表面にPd合金根を有する水紫海盗機の特勢方法において、該多孔質支持体の表面に対し、まず無電解メッキ法又はイオンプレーディング法によりPd金属の第1層を形成し、その上にPdと合金化する金属とPd金属とをウエットアロセス又はドライブロセスにより交互に多郷化した後、熱処理することを特徴とする水溝盗過郷の作戦方法。

【請求項13】上記イオンプレーティング法がアークイ オンプレーティング法である請求項10、11又は12 記載の水素済過騰の作製方法。

【請求項14】上記多孔質支持体がステンレス鋼製又は セラミックス製の多孔質支持体である請求項9、10、 11又は12記載の水素透過膜の作製方法。

【請求項15】上記Pdと合金化する金属が、Ag、Au、Pt、Rh、Ru、Ir、Sc、Y、Ce、SmXはGdである請求項9、10、11又は12記載の水素 透過限の作製方法。

【請求項16】上記P d金属と該P dと合金化する金属 との多層化を、P d金属と該P d と合金化する金属とを 交互に多層化する各層の厚みが2 μ m 以下となるように 多層化することを特徴とする請求項9、10、11又は 1 記載め未業透過腺の作変方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水素透過膜及びその作製方法に関し、より具体的には多孔質支持体の表面 にピンホールのない設密なPd合金膜を有する水素透過 膜及びその作製方法に関する。

[0002]

【軽索が終制】米素ガスは不能和結合への水薬が加用、 酸水素変用その他を確用途に供される基礎原料であり、 燃料電池用の燃料としても利用される。水素ガスの工業 的製造方法としては水の電解法、石炭やコークスのガス 化法、潜体燃料の方式化法、ガス体燃料の変成法、コー クス厚ガスの液化分離法、メタノールやアンモニアの分 解法など各種の方法が知られている。

【0003】一例として上記ガス体燃料の変成法は通常 水蒸気放質により行われるが、得られる改質ガスには主 成分である水素のほか、副生成分としてCO、CO₂ また余利日₂の が含まれている。このため、改質ガスを 例えば燃料電池にそのまま使用したのでは電池性能を阻

害してしまう。燃料電池のうちPAFCで用いる水素ガ ス中のCOは1%、PEFCでは100ppmが限度で あり、これらを越えると電池性能が著しく劣化する。 【0004】このため、それらの副生成分は燃料電池へ 導入する前に除去する必要がある。また不飽和結合への 水素添加用あるいは酸水素炎用の水素は通常ボンベに詰 めたものが使用されており、純度は5N以上が要求され ている。そのような高純度の水素得るための水素の精製 法には各種あり得るが、その例としてはPSA法、高分 子順法、Pd膜法等の水素透過膜法などが考えられる。 【0005】このうち水素透過膜法では、Pd膜等の水 素透過膜が水素のみを選択的に透過させる特性を利用す るものである。水素透過膜としては幾つかの提案がなさ れている。特開昭63-294925号においては、多 数の小孔を有する耐熱性多孔体の表面にPd薄膜、その 上に銅薄膜を共に化学メッキ法により形成し、次いで3 00~540℃の温度で熱処理して製造している。また 特開平1-164419号では、Pd薄膜上に銀薄膜を 形成する点以外は特開昭63-294925号の場合と ほぼ同様である。

【0006】ところで、Pel限は水素消息性の高い金属 膜であるが、水素能化温度が存在するため(すなわち温 度300で以下では酸化するので、300で以上でしか 使用できない)、その取り吸いがはなはな問題であっ た。また鑑賞型、ッキ法は多形の上にピンホールのな い磁密な水素造過膜を作製できる方法であるが、工業的 応用に耐える機密なり自含金膜を作製することはできな かった。

【0007】この点、特公平8-32296号には、耐 熱性多孔質体の表面に化学メッキ法により自用度多形成 し、その上に化学メッキ法により強限を形成した後、熱 処理を800~1300℃温度で3~16時間行い、 Pd60~95wtが、A85~40wt%の範囲で実 度上均一空組度を有するPd合金限よりなる水素分離膜 の製造方法が記載されている。しかしこの技術は、酸化 物の生産等により、歩留まりが悪くなる欠点があった。 「00081

【発野が終決しようとする基題】本勢門者は、多孔領支 特体の表面にア 自合金膜を有する水素造融度を再襲する 場合の各種成膜法について追求したところ、その成膜法 として物に無電解メッキ法及びイオンアレーティング法 を適用し、多孔弧の支持体の表面に対してア 4金属と A 底、Au、R・サの金属とを変互に多層化して熟地することにより、多孔弧支持体の表面に対して直接にピンホールのない観密なア 0 台金膜が作製できることを見い 出した。

【0009】すなわち本発明は、多孔質支持体の表面に Pd合金融を有する水紫透過腺を作製するに際し、無電 解メッキ法又はイオンプレーティング法を適用し、Pd 金属とAg、Au、Pt等の金属とを交互に多層化して 熱処理することにより、P d 合金膜を多孔質支持体の表面にピンホールなく緻密に成膜する水素透過限の作製方 法及びこれにより得られる水素透過膜を提供することを 目的とする。

[0010]

【課題は解決するための手段】本売明は、(1)多孔質 支持体の表面にPd合金膜を有する水素遊過酸であっ 、該Pd合金膜が、該多孔質支持体の表面に対して無 電解メッキ法によりPd金属と該Pdと合金化する金属 とをその最上層がPd層となるように交互に多層代層と とを表の機・熱処理して形成されたPd合金膜であることを 特徴とする水素粉治膜を指伸する。

[0011]本専門は、(2)多孔真主持体の表面にPd合金酸を有する水素透過機の作談方法において、該多 和波支持体の表面に対して無電解メッキ法によりPd金 属と該Pdと合金化する金属とをその最上層がPd層と なるように交互に多層化した像、熱処理することを特徴 とする水素透過の作野方法を提供する。

[0012]本発明は、(3)多孔東法神体の表面にP 付金銀度を有する水素澄過限であって、該P 付金銀度 が、該多孔質支持体の表面に対してイオンプレーティン /法によりP 付金銀と該P 付と合金代する金属とを交互 に多番化層とした後、熟処理して形成されたP 付金金膜 であることを特徴とする水素溶過膜を提供する。

[0013] 本発明は、(4)多孔葉支持体の表面にP d合血酸を有する水素透過膜の作製方法において、影多 和度支持体の表面に対してイオンプレーティング法によ りPd金属と該Pdと合金化する金属とを交互に多層化 した後、熟処理することを特別とする水素透過膜の作製 方法を提供する。

【0014】本祭明社、(5)多孔療主特体の表面にPd合無限を有する水素造過機であって、態Pd合機 が、該多孔質支持体の表面に対してイオンプレーティン グ法によりPd金属と該Pdと合金化する金属とをその 最上期がPd機となるように交互に多層化層とした後、 熱処理して形成されたPd合金膜であることを特徴とする る水紫治過度を提供する。

【0015】本原明社、(6)多孔東末時体の地面にPd会額をする水素透過期の作暇方法において、該多孔質支持体の変面に対してイオンプレーティング法によりPd会属と該Pdと合金性する金属とをその後上層がPd局となるように交互に多層化して徐熱処理することを特徴とする水素透過環の作取方法を提供する。

【0016】本期別法 (7)多刊度主持体の表面にPd合金服を有する水素造場販であって、該Pd合金服 が、該多利度支持体の表面に対して無電解メッキ法又はイオンアレーティング法により形成されたPd金属の第1届上に、Pdと合金化でも金属とPd金属とをウエットプロセス又はドライブロセスにより交互に多層化層とした後、熱処理して形成されたPd合金服であることを

特徴とする水素透過膜を提供する。

[0017] さらに本券明は(8)多月復支持体の表面 にPd含金膜を有する木紫池造販の作製方法において、 該多月復支持体の表面に対し、まず紫電解メットさた又は イオンフレーティング法によりPd金属の第1履老形成 し、その上にPeと含金化でも金属とPd金属とをウエ ットプロセス又はドライプロセスにより交互に多層化し た後、熱処理することを特徴とする木紫池造販の作製方 法を提供する。

[0018]

【発明の実施の形態】本界明における多孔質支持体としてはステンレス網膜やモラミックス製の多孔質支持体が 用いられる。ステンレス網膜の多孔質支持体の耐として は、エッチングで孔(細孔)をあけたステンレス網膜を 打震体やステンルス網段を成形した終土した多孔質体が挙 げられる。また、セラミックスにはアルミナ等の酸化物 系、整代性素等の整化物系、炭化珪素等の炭化物系をど 各種あるが、これら述面が難じて用いられる。また、 素透過膜は板状、酸いは円筒状等各種形状で構成される が、未実明においては多孔度支持体の形状を設定するこ とで建立を影響とすることができる

[0019]本売明においては、多孔原支持体表面にP 金属の機及び転り dと合金化する金属の側を順次預算 するが、その第1周を無値様メッキ抜びはイオンプレー ティン学法により形成することが重要である。これによ り多孔質支持体の表面にピンホールのない観察な? d 金属膜の対象があることができる。この第1周としてはP d金属膜又は該P d と合金化する金属の側の何れでもよ いが、好ましくはP d金属の脱が適用される。

【0020】本売明で用いるPd金属と合金化する金属の貯ましい例としてはAg、Au、Pt、Rh、Ru、Ir、Sc、Y、Ce、Sm又はGdが挙げられる。Pd金属と合金化する金属のPd金属に対する量が割合は 所認特性の水素治臓に応じて選定されるが、例えるよと本売明においてはPd金属と語Pd金属と合金化する金属とを支配で多層化される各層の厚えれるもの場合とは2um以下となるように多層化を表しまるとなる場の厚えば、熱児順により顕微で均一な合金膜を得る上で重要である。

【00211前記(3)~(4)の発明では、第1屋を イオンプレーティング法により形成した後、イオンプレ ーティング法により肌次口金属と該庁 dと合金化する 金属とが交互に多層化される。また前記(7)~(8) の発明では、まず無電解メッキ法又はイオンプレーティ ング法により日金属の第1層を形成し、その上にPd と合金化する金属とPd金属とがウエットプロセス又は ドライプロセス(ドライプレーティング)により交互に 多層化される。 【0022】この場合、無電解メッキ法収払イオンプレーティング法により形成された第1届により多孔賞支持体表側の細形が響められているのでビンホールのない順が形成される、ウエットプロセスには地電解メッキ法のは、電気メッキ法があり、ドライプロセスにはイオンプレーティングをのほか、真空悪着法、スパック法、CVD法、PVD法等各種もあが、(7)へ(8)の発明においては何れら使用される。無事解メッキ法定イオンプレーティング法により形成された第1届により多孔質支持体表面の細孔が埋められているのでビンホールのない場形が振される。

【0024】未売明における無電解メッキ法での使用禁 置としては無難が、ッキ法用として適用し得る指律であ れば使用される。無電解メッキ法を適用するに際して は、Pd金属及び話Pd金属と合金化する金属をメッキ 清海中に可溶性の場の形で存在させる。Pdの場合は、 例えば据化パラシウム等のハロゲン化物、網底、硫酸塩 等の形で存在させることができる。Agの場合は別えば 領職機、塩化提等のハロゲン化物等の所で使用され、ま た上屋Au、Pt、Rt 時の場合にもメッキ溶液中に可 溶性少塩の形で存在させる。

【0025】上原メッキ部次中には第元制を共称させる が、還元制としては無電解メッキ法で用いられる還元利 であれば特に限定社なく、その例としてはとドラジン、 アルデヒド類、未禁化ホン酸ナトリウム、ブドウ糖など が挙針される。これらは中仓無限の態度及び撃中仓 属と合金化する金属の層の形成に際して適宜選定して用 いられる。またメッキ液には必要に応じ補助成分を含有 させてもよい。

【0026】また、イオンブレーティング法での使用態 変としてはイオンブレーティング法則と ご適用し根る 構造であれば使用されるが、図1はその例としてアーク イオンプレーディング法を実施する配慮例を示す図である。 1は装置等限。2は不管形式表現/を、3は真空引用時常、4は基股オルダーであり、その上に多工賃基板 ラけケ電器とある。6はRドバイア公園。7は直接の用金が高級による。10はア・バースの個別、7は高級による。2はアーグット(膜形成用金属)である。基板ワとターゲット 8間の印度は装置の列 保、度販条件等の側により変更設定されるが、例えば

28 c m程度とされる。

【0027】本装置の操作時においてはRFバイアス電 源6により基板5に負(マイナス)の電圧がかけられ る。導入管2から容器1内に不活性ガス、例えばArを 導入してガス圧を10-2Torr程度に保ち、直流電源 7から南流電圧を印加すると、グロー放電により基板5 とターゲット9間に安定なプラズマが発生する。同時に アーク電極8とターゲット9の間にアーク火花が発生し てターゲット金属が蒸発する。これがプラズマ中を通過 する際にイオン化され、正イオンとなって基板に激突し 基板5の表面に成膜される。2種以上の金属膜を積層す る場合にはターゲット9を替えることにより行われる。 【0028】成膜の条件としては、成膜用金属の種類に 応じて設定される。例えば背圧としては好ましくは1. 0×10-5Torr程度、不活性ガス圧としては好まし くは0.3~4.0×10-2Torrの範囲で実施され る。さらにアーク電流値は金属の種類に応じて設定さ れ、Pdの場合は45A程度(100V)、Nbの場合 は80A(100V)というようにして実施することが できる。 【0029】以上のようにして、Pd金属と該Pdと合

屬がAgである場合、まず多孔質支持体面に第1の層と してPd膜を形成し、その上に第2の層としてAg膜を 形成し、第3の層としてPd膜を形成する・・・という ようにして層状に積層することにより形成される。こう して積層された膜厚は、水素透過性金属膜として必要な 厚さ、すなわち水素以外の成分が透過せず、水素のみを 選択的に透過させ得る厚さであれば特に限定はないが、 好ましくは $0.1\sim20\mu$ m程度の厚さに形成される。 【0030】本発明においては、多孔質支持体の表面に P d金属と該P d金属と合金化する金属とを交互に積層 した後、熱処理(焼成)することが必要である。この熱 処理により両金属が固溶体化し、合金化される。その焼 成は両金屋層により周溶体化し合金化する温度、例えば 800℃以上というような温度で熱処理することにより 行われる。本発明においては、以上のようにして多孔質 の支持体に直接にピンホールのない緻密なP d合金膜か

金化する金属が層状に精層される、Pdと合金化する金

【0031】本発明により得られた水素透過膜について の実測値によれば、例えば従来における無電解メッキ法 で作製されたPd水素透過隙(透過性能=2×10-8m o 1/msec Pa^{0.5})の1,5倍の性能が発揮でき る。また水素含有ガスは水素透過膜に通すことにより精 製されるが、本発明の水素透過膜は多孔質支持体の表面 にピンホールなく緻密に形成されているため、高純度の 水素が得られる。

らなる水零汚過膨が再現件よく得られる。

[0032]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明をさらに詳しく 説明するが、本発明がこれら実施例に限定されないこと けもちろんである.

【0033】《実施例1》シリカをコーティングしたス テンレス翻製の金属多孔体の表面を塩化スズ水溶液で感 受性化し、さらに塩化パラジウム(II)の水溶液を用 いてPdメッキの核生成を行った。この処理は該表面の 活性化処理に相当するものである。次いでヒドラジンを 環元割とするメッキ浴を用いてPdを1時間メッキし た。引続きPdのコーティング層の表面を上記と同じく 塩化スズ水溶液で感受性化し、さらに塩化パラジウム (II) 水溶液を用いてAgメッキの核生成を行った。 【0034】次いで、ヒドラジンを還元剤とするメッキ 浴を用いて硝酸銀をヒドラジンにより還元し、Agを4 0分間メッキした。以上のプロセスを6回繰り返し、合 計12層の膜 (厚さ18 μ m、すなわち $Pd=2\mu$ m× 6回+Ag=1 μ m×6回)を得、同様にして最上層に Pdをメッキした。これらの処理において各層のメッキ 時間はPdとAgの全量がPd/Ag重量比で77/2 3となるようにした。こうして得られた膜を11/mi n (毎分当り1リットル)の窒素気流中、温度900℃ で10時間熱処理してPdとAgとの合金膜を得た。 【0035】図2~図4は以上の工程で得られた合金膜 の隣の断面を拡大した写真であり(走査型電子顕微鏡写 真)、倍率は10,000倍である。上記のとおり、P dとAgとは交互に層状に積層されているが、熱処理 後、すなわち焼成後の断面である図1の写真によれば、 両金属は相互に緻密に固溶体化し、合金化していること が分かる。また、図2及び図3は、それぞれ、電子線プ ローブマイクロアナライザー法によるPd及びAgの分 布であるが、両金属が均一に分散していることが観察さ れる。

【0036】《実施例2》実施例1におけるAgに代え てPtを用いた以外は、実施例1と同様にしてPdとP tとの合金膜を得た。こうして得られた合金膜を上記と 同様にして観察したところ、実施例1と同様な状態であ ることが確認された。

【0037】《実施例3》実施例1におけるAgに代え てCeを用いた以外は、実施例1と同様にしてPdとP tとの合金膜を得た。こうして得られた合金膜を上記と 同様にして観察したところ、実施例1と同様な状態であ ることが確認された。

【0038】《実施例4》本実施例における使用装置と しては図1に示すような装置を使用した。ターゲット9 としてР d 金属をセットし、基板 5とターゲット 9間の 距離は28cmとした。基板5として平均粒径1ミクロ ンのアルミナ粉を成形し焼結して得られたアルミナ焼結 体を用いた。成膜操作は、まず導管3から真空引きして 容器内背圧を1.0×10-5Torrとした後、導入管 2からArを導入してガス圧を0.3×10⁻²Torr に保った。

【0039】ガス圧安定後、RFバイアス電源6により

バイアス電圧を一100Vとし、直流電源7から直流電圧を100Vを印加して、アーク電流値を80Aとして作動させ、Pd限差約2μm原に成膜した。次にターゲット9としてAsの監をキットした以外は上記と同様にしてAs服を約1μm原に成膜し、以上のプロセスを6回線の返し、合計12層の膜(厚さ18μm、すなわちPd=2μm×6回)を得、同様にして成上層に約2μm原のPdを成膜した。これの規作において成膜時間を調整してPdとAsの金量がPd/Asg重量比で77/23となるようにした。こうして得られた限と11/min(供分等)到19ットルの表示が流流、温度900℃で10時間熱処理してPdとAsの金数が内が、温度900℃で10時間熱処理してPdとAsの金数で4機を分れに限さ1/min(供分等)11ットルで10歳にある。この金服はアルミナ族結構の表面に歩ーに成階された。この金服はアルミナ族結構の表面に歩ーに成階された。

100401 (実施例5) 実施例4と同様にして、アークイオンプレーティング法によりアルミナ族結構の表質を1とりに関係的2人の下の展生に限した。次に実施業務を装置を1×10 でイフィアの東空に保ち、金属Agを電子線加熱法により廃発させてAg層を約1ルm単に成限した。以上のプロセスを6回熱が遅した。6日を約12層の関係を18ルm、すなわちりは-2ルm×6回十Ag=1ルm×6回)を得た。これらの操作において成期時間を調整してPdとAgの全量がPd/Ag重量比でアプ/23 となるようにした。こうして得られた限を11/minで何労当りリットルりの警察が流中、温度90で10時間熱処理してPdとAgとの合金膜を得た。この合金膜はアルミナ焼結体の表面に均一に成膜された。

【発明の効果】本発明によれば、多孔質の支持体の表面

に対し、第1層を無電解メッキ法又はイオンブレーティング法により形成し、P d 金属及びP d と合金化する金を支圧を層化した後、発処理することによりセンホールの次い額密なP d 合金服からなる水流活過酸が得られる。またその後上層をP d 層とすることにより表面酸化化物の生成をなくし、これによる悪影響のない水流流過酸とすることができる。さらに、本売明によればP d 金属本本の特性に加え、該P d 金属と合金化する金属の特性を含むせつ水素流過酸が再現性よく得られる

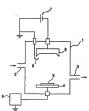
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明において適用し得るイオンプレーティン グ法を実施する装置態様の一例を示す図。
- 【図2】実施例1で得られた膜の断面を拡大した写真 (10,000倍)。
- 【図3】実施例1で得られた膜の断面におけるPdの分布を示す写真(10,000倍)。
- 【図4】実施例1で得られた膜の断面におけるAgの分布を示す写真(10.000倍)。

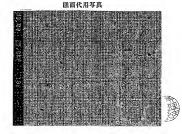
【符号の説明】

- 装置容器
 不活性ガス導入管
- 2 个位性从人等人
- 3 真空引用導管
- 4 基板ホルダー 5 多孔質基板
- 6 RFバイアス電源
- 7 直流アーク電源
- 8 アーク電極

[図1]



【図2】



【図3】

図面代用写真



【図4】

図面代用写真

